

ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ

УДК 535.343.2:535.548

МАТРИЧНОЕ ОПИСАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУРАХ С НЕЛОКАЛЬНЫМ ОТКЛИКОМ

В. Г. Авраменко, А. А. Никулин
(кафедра квантовой электроники)

Формализм матриц распространения оптического излучения в слоистой среде обобщен на случай слоев с существенно нелокальным откликом в направлении, перпендикулярном границам раздела.

Использование матриц распространения является наиболее эффективным способом описания линейных [1] и нелинейных [2] оптических свойств плоскостойких сред с локальной диэлектрической проницаемостью, являющейся кусочно-постоянной функцией координаты в направлении нормали к слоям. В настоящей работе предложено обобщение метода матриц распространения на случай многослойных наноструктур, обладающих нелокальным оптическим откликом в направлении, перпендикулярном границам раздела. Типичный пример таких систем — полупроводниковые периодические квантовые ямы, интенсивно исследуемые в последнее десятилетие [3–5]. В дальнейшем для определенности мы будем называть слои с нелокальным откликом квантовыми ямами (КЯ).

Выберем декартову ось z перпендикулярной плоскости КЯ. На систему, которую будем считать однородной и изотропной в плоскости xy , падает плоская линейно-поляризованная электромагнитная волна с частотой ω и тангенциальной к плоскости КЯ компонентой волнового вектора $\mathbf{q}_{\parallel} = q\mathbf{e}_x$ (\mathbf{e}_x — орт в направлении оси x). В силу отмеченных свойств симметрии величины, характеризующие линейный оптический отклик системы (напряженность электрического поля, плотность индуцированного тока), имеют вид $\mathbf{Q}^{(\alpha)}(x, z, t) = \mathbf{Q}^{(\alpha)}(z)e^{i(qx - \omega t)}$, где $\alpha = p, s$, а индексы p и s обозначают величины, относящиеся к отклику на p - и s -поляризованное излучение соответственно. В дальнейшем для краткости будем опускать общий для всех величин множитель $e^{i(qx - \omega t)}$, интересуясь амплитудами $\mathbf{Q}^{(\alpha)}(z)$.

Рассмотрим вспомогательную задачу об отклике среды с одной КЯ. Будем считать, что последняя имеет толщину d и занимает слой $-\frac{d}{2} \leq z \leq \frac{d}{2}$. Отклик КЯ на частоте ω характеризуется локальной фоновой диэлектрической проницаемостью ε_0 и тензором нелокальной проводимости $\hat{\sigma}(z, z')$, причем $\hat{\sigma}(z, z')|_{|z| > d/2} = \hat{\sigma}(z, z')|_{|z'| > d/2} \equiv 0$. Кроме того, положим $\sigma_{xy} = \sigma_{yx} = \sigma_{yz} = \sigma_{zy} \equiv 0$. Полупространства $z < -\frac{d}{2}$ и $z > \frac{d}{2}$ заполнены диэлектриком с локаль-

ной проницаемостью ε . Вне КЯ поле $\mathbf{E}^{(\alpha)}(z)$ является суперпозицией волн, распространяющихся вдоль положительного и отрицательного направлений на оси z . Введем обозначения $\mathbf{E}^{(\alpha)}(z < -\frac{d}{2}) \equiv \mathbf{E}_l^{(\alpha)}(z)$ и $\mathbf{E}^{(\alpha)}(z > \frac{d}{2}) \equiv \mathbf{E}_r^{(\alpha)}(z)$. Тогда

$$\mathbf{E}_\beta^{(\alpha)}(z) = \mathbf{e}_+^{(\alpha)} E_\beta^{(\alpha)} e^{i\kappa(z - s_\beta d/2)} + \mathbf{e}_-^{(\alpha)} \bar{E}_\beta^{(\alpha)} e^{-i\kappa(z - s_\beta d/2)}, \quad \beta = l, r, \quad (1)$$

где $s_l = -1$, $s_r = 1$, $\kappa = \sqrt{\varepsilon \frac{\omega^2}{c^2} - q^2}$, $\mathbf{e}_+^{(s)} = \mathbf{e}_-^{(s)} = \mathbf{e}_y$, $\mathbf{e}_\pm^{(p)} = \frac{c\sqrt{\varepsilon}}{\omega} (\kappa \mathbf{e}_x \mp q \mathbf{e}_z)$, \mathbf{e}_y и \mathbf{e}_z — орты в направлении осей y и z , а $E_\beta^{(\alpha)}$ и $\bar{E}_\beta^{(\alpha)}$ — комплексные амплитуды. Сначала исследуем случай $\varepsilon = \varepsilon_0$. Поле $\mathbf{E}^{(\alpha)}(z)$ удовлетворяет интегральному уравнению [6]

$$\mathbf{E}^{(\alpha)}(z) = \mathbf{E}_0^{(\alpha)}(z) - \gamma \int_{-d/2}^{d/2} \int_{-d/2}^{d/2} \hat{G}^{(\alpha)}(z - z') \times \hat{\sigma}(z', z'') \mathbf{E}^{(\alpha)}(z'') dz' dz'', \quad (2)$$

где $\gamma = 4\pi i \omega \varepsilon_0 / c^2$, $\mathbf{E}_0^{(\alpha)}(z)$ — поле в отсутствие нелокальности, $\hat{G}^{(s)}(z) = G_{yy}(z) \mathbf{e}_y \mathbf{e}_y$, $\hat{G}^{(p)}(z) = \hat{G}(z) - \hat{G}^{(s)}(z)$, а $\hat{G}(z)$ — тензорная функция Грина [6] электромагнитного поля с частотой ω и фиксированной компонентой волнового вектора $\mathbf{q}_{\parallel} = q\mathbf{e}_x$ в однородной среде с проницаемостью ε_0 . Запись вида \mathbf{ab} означает диадное представление тензора 2-го ранга. Учтем, что вне КЯ (т.е. при $|z| > \frac{d}{2}$) второе слагаемое в правой части (2) описывает лишь расходящиеся от КЯ волны, и выразим поле $\mathbf{E}_0^{(\alpha)}(z)$ через введенные соотношением (1) амплитуды:

$$\mathbf{E}_0^{(\alpha)}(z) = \mathbf{e}_+^{(\alpha)} E_l^{(\alpha)} e^{i\kappa(z + d/2)} + \mathbf{e}_-^{(\alpha)} \bar{E}_r^{(\alpha)} e^{-i\kappa(z - d/2)}.$$

Тогда при любом z решение уравнения (2) представимо в следующем виде:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}^{(\alpha)}(z) &= \mathbf{T}_+^{(\alpha)}(z) \mathbf{E}_l^{(\alpha)} + \mathbf{T}_-^{(\alpha)}(z) \bar{\mathbf{E}}_r^{(\alpha)}, \\ \mathbf{T}_{\pm}^{(\alpha)}(z) &= e^{i\kappa d/2} \int_{-d/2}^{d/2} e^{\pm i\kappa z'} \hat{T}^{(\alpha)}(z, z') dz' \mathbf{e}_{\pm}^{(\alpha)}, \end{aligned} \quad (3)$$

где тензор $\hat{T}^{(\alpha)}(z, z')$ удовлетворяет интегральному уравнению

$$\begin{aligned} \hat{T}^{(\alpha)}(z, z') + \gamma \int_{-d/2}^{d/2} \int_{-d/2}^{d/2} \hat{G}^{(\alpha)}(z, z'') \times \\ \times \hat{\sigma}(z'', z''') \hat{T}^{(\alpha)}(z''', z') dz'' dz''' = \delta(z - z') \hat{I}, \end{aligned} \quad (4)$$

\hat{I} — единичный тензор, $\delta(z - z')$ — дельта-функция Дирака. Отметим, что при микроскопическом описании нелокального отклика КЯ учет размерного квантования движения носителей поперек КЯ приводит к факторизации зависимости тензора $\hat{\sigma}(z, z')$ от координат z и z' [5]: $\sigma_{\mu\nu}(z, z') = \sigma_{\mu\nu} \zeta_{\mu\nu}(z) \zeta_{\mu\nu}(z')$, где $\zeta_{\mu\nu}(z)$ — известные функции. В этом представляющем практический интерес случае уравнение (4) сводится к алгебраическому, что позволяет найти $\hat{T}^{(\alpha)}(z, z')$ в явном виде.

Из (3) следует искомое соотношение между амплитудами волн по обе стороны от области с нелокальным откликом

$$\begin{pmatrix} E_r^{(\alpha)} \\ \bar{E}_r^{(\alpha)} \end{pmatrix} = M^{(\alpha)} \begin{pmatrix} E_l^{(\alpha)} \\ \bar{E}_l^{(\alpha)} \end{pmatrix}, \quad \alpha = s, p \quad (5)$$

$$M^{(\alpha)} = \frac{1}{K_4^{(\alpha)}} \begin{pmatrix} K_1^{(\alpha)} K_4^{(\alpha)} + K_2^{(\alpha)} K_3^{(\alpha)} & K_2^{(\alpha)} \\ K_3^{(\alpha)} & 1 \end{pmatrix},$$

где $K_1^{(s)} = \mathbf{e}_y \mathbf{T}_+^{(s)}(d/2)$, $K_2^{(s)} = \mathbf{e}_y \mathbf{T}_-^{(s)}(d/2) - 1$, $K_3^{(s)} = 1 - \mathbf{e}_y \mathbf{T}_+^{(s)}(-d/2)$, $K_4^{(s)} = \mathbf{e}_y \mathbf{T}_-^{(s)}(-d/2)$, $K_1^{(p)} = \xi \mathbf{e}_x \mathbf{T}_+^{(p)}(d/2)$, $K_2^{(p)} = \xi \mathbf{e}_x \mathbf{T}_-^{(p)}(d/2) - 1$, $K_3^{(p)} = 1 - \xi \mathbf{e}_x \mathbf{T}_+^{(p)}(-d/2)$, $K_4^{(p)} = \xi \mathbf{e}_x \mathbf{T}_-^{(p)}(-d/2)$, $\xi = \sqrt{1 + q^2/\kappa^2}$. Матрица $M^{(\alpha)}$ является обобщением стандартной матрицы распространения на случай слоя с нелокальным откликом при $\varepsilon = \varepsilon_0$.

Для $\varepsilon \neq \varepsilon_0$ соотношение (5) остается в силе при замене матрицы $M^{(\alpha)}$ на матрицу $\tilde{M}^{(\alpha)}$:

$$\tilde{M}^{(\alpha)} = \left[\mathbf{m}_{d,w}^{(\alpha)} \right]^{-1} M^{(\alpha)} \mathbf{m}_{d,w}^{(\alpha)}, \quad (6)$$

где $\mathbf{m}_{d,w}^{(\alpha)}$ — введенная в [2] матрица распространения линейно поляризованного излучения через границу

раздела сред с локальными диэлектрическими проницаемостями $\varepsilon_d = \varepsilon$ и $\varepsilon_w = \varepsilon_0$.

Соотношения (5) и (6) позволяют описывать, перемножая соответствующие матрицы, распространение монохроматического излучения в слоистых структурах с произвольным числом чередующихся слоев с локальным и нелокальным откликом. Рассчитаем, например, коэффициент отражения нанесенной на полубесконечную подложку структуры из N КЯ, чередующихся с $N + 1$ диэлектрическим слоем (толщиной D каждый). Области $z < 0$ соответствует вакуум, а область $z > N(d + D) + D$ (подложка) заполнена средой с локальной проницаемостью $\bar{\varepsilon}$. В этом случае матрица распространения через всю структуру равна

$$\mathbf{T}^{(\alpha)} = \mathbf{m}_{s,d}^{(\alpha)} \mathbf{t}_d \left[\tilde{M}^{(\alpha)} \mathbf{t}_d \right]^N \mathbf{m}_{d,v}^{(\alpha)},$$

где \mathbf{t}_d — матрица распространения через слой диэлектрика [2], а $\mathbf{m}_{d,v}^{(\alpha)}$ и $\mathbf{m}_{s,d}^{(\alpha)}$ — матрицы распространения через границы раздела диэлектрик-вакуум ($\varepsilon_d = \varepsilon$, $\varepsilon_v = 1$) и подложка-диэлектрик ($\varepsilon_s = \bar{\varepsilon}$, $\varepsilon_d = \varepsilon$) соответственно. Коэффициент отражения для падающей со стороны вакуума линейно поляризованной волны определяется элементами матрицы $\mathbf{T}^{(\alpha)}$:

$$r^{(\alpha)} = -T_{21}^{(\alpha)} / T_{22}^{(\alpha)}, \quad \alpha = s, p$$

по аналогии с выражением, полученным в [2] для сред с локальным откликом.

Таким образом, в работе показано, что оптическое поле внутри многослойных структур с нелокальным откликом может быть описано с помощью обобщенных матриц распространения $M^{(\alpha)}$, выражаемых через векторы $\mathbf{T}_{\pm}^{(\alpha)}(z)$; последние рассчитываются на основе решения интегрального уравнения для поля внутри отдельного слоя структуры.

Литература

1. Born M., Wolf E. Principles of Optics. 4th ed. Oxford, 1970.
2. Bethune D.S. // J. Opt. Soc. Am. B, 1989. **6**. P. 910.
3. Keller O., Liu A., Zayats A. // Opt. Commun. 1994. **110**. P. 604.
4. Dolgova T.V., Avramenko V.G., Nikulin A.A. et al. // Appl. Phys. B. 2002. **74**. P. 671.
5. Liu A. // Phys. Rev. B. 1994. **50**. P. 8569.
6. Keller O. // Phys. Rev. B. 1988. **37**. P. 10588.

Поступила в редакцию
16.01.06